

L'inspection à rayons-x

OMRON



nouveau

VT-X700

Présent depuis de très nombreuses années dans l'AOI, OMRON a mis au point un nouveau système d'inspection AXI pour répondre aux besoins croissants de l'industrie de haute densité contenant des PCB. La VT-X700 représente une approche innovante et originale de l'AXI en combinant 2 types d'algorithme différents en 3D afin d'avoir des temps de traitement d'image de 500ms par projection. La VT-X700 est la solution idéale pour l'inspection automa-

tisée en ligne de la non-mouillabilité BGA et des talons de soudure, qui sont au-delà des capacités des systèmes standards AOI.

- Inspection algorithmique automatisée par tomosynthèse (inspection rapide) et tomographie (inspection de très haute précision pour une détection fine)
- Résolution de 7, 10, 15, 20 et 25µm/pixel à des angles de 0°, 15°, 30° et 45°

nouveau

Seica

Test Solutions

GAMME SPHINX

Développée en partenariat avec SEICA, la gamme SPHINX répond parfaitement aux demandes les plus sophistiquées de la production de cartes électroniques.

- Source x-ray jusqu'à 130 kV avec tube microfoyer selon modèle
- Inspection manuelle en temps réel ou semi-automatique (algorithmique)
- 5 axes contrôlés par joystick ou écran tactile (selon modèle) : X, Y, Z, inclinaison X, inclinaison Y

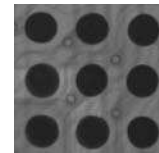
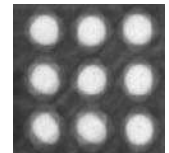
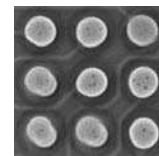


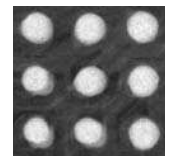
Image 2D



Laminographie



Tomosynthèse



Tomographie

Les testeurs in-situ

En parfaite cohérence avec les sondes mobiles, les produits in-situ et fonctionnels de SEICA complètent le panel de solutions de test nécessaires pour répondre à la problématique actuelle. La nouvelle famille de testeurs de production offre de nouvelles perspectives dans la chaîne de contrôle, en adoptant une même plateforme.

Seica

Test Solutions

GAMME STRATEGY

Afin de fournir des solutions plus cohérentes aux besoins actuels, les testeurs in-situ SEICA s'articulent aujourd'hui autour de la Série STRATEGY. Différentes solutions ergonomiques sont possibles selon les besoins d'utilisation : coffret, bureau ou baie verticale.



Testeur in-situ

- Jusqu'à 2048 canaux in-situ «pure pin», non multiplexés, analogiques, numériques ou hybrides 10MHz
- Test sans vecteurs jusqu'à 64 sondes OpenFix
- Développement automatique du programme de test in-situ avec passeurs CAO intégrés.
- Mise au point manuelle ou automatique avec l'aide d'outils disponibles en standard tels que gestion statistique, scope, schéma de la carte à l'écran, etc.
- Chargement de mémoires, boundary scan, in-situ haute tension
- Ergonomie standard ou personnalisée, du low cost au système en ligne, en fonction du besoin

Testeur combiné in-situ / fonctionnel

- Configuration in-situ telle que présentée ci-dessus
- Ressources fonctionnelles en standard (générateurs de fonctions, générateurs arbitraires, fréquencemètre, oscilloscope, ampèremètre, voltmètre, etc.) disponibles sur chaque point test
- Matrice 4 ou 8 lignes, adaptée au faible ou fort courant, à la haute tension
- Gestion d'instruments externes (IEEE, PXI, VXI, etc.), connectables à la matrice et disponibles sur chaque canaux